(11) 特許番号

						特許第	54766549号
(45)発行日	平成235	≢9月7日 (20 11.9.7)		(24)登録日	平成23年6月24E	(2011.6.24)
(51) Int.Cl.			FI				
HO1J	49/10	(2006.01)	HO1 J	49/10			
GO1N	27/62	(2006.01)	GO1N	27/62	K		
GO1N	27/64	(2006.01)	GO1N	27/64	В		
HO1J	49/40	(2006.01)	H01J	49/40			
H01J	49/42	(2006.01)	H01 J	49/42			
						請求項の数 3	(全 10 頁)
(21) 出願番号		特願2005-247134	(P2005-247134)	(73)特許権者	f 000001993		
(22) 出願日		平成17年8月29日	(2005.8.29)		株式会社島津	製作所	
(65) 公開番号		特開2007-66533(P2007-66533A)		京都府京都市	「中京区西ノ京桑」	原町1番地
(43) 公開日		平成19年3月15日	(2007.3.15)	(73)特許権者	f 504261077		
審査請求日		平成20年8月26日	(2008.8.26)		大学共同利用機関法人自然科学研究機構		
					東京都三鷹市	「大沢二丁目21番	昏1号
特許法第30条第1項適用 独立行政法人日本学術振興				(74)代理人	110001069		
会 マイクロビームアナリシス第141委員会 第11					特許業務法人京都国際特許事務所		
9回研究会資料、平成17年3月1日発行 日本質量分				(74)代理人	100095670		
析学会 第5	3回質	量分析総合討論会	(2005) 講		弁理士 小林	7 良平	
演要旨集、2	0054	₽5月25日発行		(72)発明者	小河 潔		
					京都市中京区	西ノ京桑原町1省	昏地 株式会
					社島津製作所	内	
						最新	冬頁に続く

(12)特許公報(B2)

(54) 【発明の名称】 レーザー照射質量分析装置

(57)【特許請求の範囲】

(19) 日本国特許庁(JP)

【請求項1】

照射位置を制御し<u>ながら</u>試料に<u>繰り返し</u>レーザーを照射し、そこで生成された試料のイオンを質量分析して、試料の位置情報とその位置における質量分析情報を得る<u>ことにより</u>、質量分析情報の2次元像を得るレーザー照射質量分析装置において、

前記レーザーの照射位置を順次移動させるためにステージを移動する及び / 又はレーザ ー光を走査する機構と、

前記機構により、前記レーザーの照射位置を順次移動させるごとに質量分析を行う計測 ・制御部とを備え、

該イオンの質量分析に、周波数駆動型イオントラップと飛行時間型質量分析装置を用い ¹⁰ ることを特徴とするレーザー照射質量分析装置。

【請求項2】

周波数駆動型イオントラップの駆動方式としてデジタル駆動方式を用いることを特徴と する請求項1に記載のレーザー照射質量分析装置。

【請求項3】

飛行時間型質量分析装置にマルチターン型飛行時間質量分析装置を用いることを特徴と する請求項1又は2に記載のレーザー照射質量分析装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、レーザー光を試料に照射してイオン化を行うイオン源を備える質量分析装置 、具体的には、レーザー脱離イオン化法(LDI=Laser Desorption /Ionization)やマ トリクス支援レーザー脱離イオン化法(MALDI=Matrix Assisted Laser Desorption /Ionization)によるイオン源を備える質量分析装置に関する。これらの装置の典型的な 応用例は、顕微質量分析装置や質量分析顕微鏡である。

【背景技術】

【0002】

レーザー脱離イオン化法(LDI)は、試料にレーザー光を照射し、レーザー光を吸収 した物質の内部で電荷の移動を促進させてイオン化を行うものである。また、マトリクス 支援レーザー脱離イオン化法(MALDI)は、レーザー光を吸収しにくい試料やタンパ ク質などレーザー光で損傷を受けやすい試料を分析するために、レーザー光を吸収し易く イオン化し易い物質をマトリクスとして試料に予め混合しておき、これにレーザー光を照 射することで試料をイオン化するものである。特にMALDIを用いた質量分析装置は、 分子量の大きな高分子化合物をあまり開裂させることなく分析することが可能であり、し かも微量分析にも好適であることから、近年、生命科学などの分野で広範に利用されてい る。なお、本明細書では、LDIやMALDIによるイオン源を備える質量分析装置を総 称して、LDI/MALDI- MSと記すこととする。

【0003】

顕微質量分析装置及び質量分析顕微鏡は、異なる概念に基づいて製作されるものである 。顕微質量分析装置は、顕微鏡にて光学的に試料の顕微像を観察し、その観察像で特定の 質量分析位置を決定して、その箇所の質量分析を行うというもので、光学観察結果を用い て質量分析を行うとというものである。一方、質量分析顕微鏡は、質量分析により得られ た信号を用いて試料の微細な2次元像を得るというもので、顕微鏡像の組織識別手段とし て質量分析の結果を用いるというものである。

いずれにせよ、上記LDI/MALDI-MSを用いる場合、照射レーザー光のスポット径を微小に絞ることにより、微小部分の質量分析を行うことができ、また、高解像度の 質量分析顕微鏡像を得ることができる(非特許文献1、特許文献1)。

【0004】

本出願では、これらをまとめて顕微質量分析装置と呼ぶ。

【0005】

従来の顕微質量分析装置の構成の一例を図1に示す。オペレータはCCD11又は接眼 レンズで試料12を観察し、観察像から質量分析箇所を決定する。そして、分析開始操作 を行うことにより、レーザー光源13からレーザーパルスが試料12のその箇所に照射さ れる。すなわち、観察光学系とレーザー照射光学系は、そのような位置関係となるように 設定されている。

【0006】

なお、観察時に1点だけを決め、質量分析はその点のみで行うこともあるし、観察時に 広がりのある領域(単一領域又は複数に亘る領域)を決めておき、分析時にはその領域内 でレーザー光を走査して、その領域内の試料の面分析を行うこともある。また、レーザー 光の照射位置を線(直線、曲線)状に移動させ、ラインプロファイルをとる場合もある。 【0007】

レーザー光が照射された箇所では試料がイオン化し、生成されたイオン14がイオンガ イド15に導かれて質量分析部16に入る。ここで質量分析を行うことにより、レーザー 照射箇所の質量分析プロファイルを得ることができる。

【 0 0 0 8 】

図1には試料12の分析箇所の正確な位置関係を観察することができる光学系を備えた 装置の例を示したが、必ずしもきちんとした光学観察系がなくとも顕微質量分析は行うこ とができる。すなわち、目視或いは簡便な光学観察手段だけで試料へのレーザー照射位置 を確認し、その後、ステージを移動させながら、或いはレーザー照射位置を移動させなが ら質量分析を行うことにより、2次元的な質量分析情報を得ることができる。すなわち、 10

30

20

顕微質量分析を行うことができる。

【0009】

質量分解能の高い質量分析を行おうとする場合、質量分析部16には飛行時間型質量分 析装置(Time Of Flight Mass Spectrometer = TOFMS)を用いることが望ましい。 T OFMSでは、加速されたイオンが一定距離を飛行する時間がそのイオンの質量に依存す ることを利用して分析を行う。すなわち、イオンを所定の位置から一斉にスタートさせ、 各イオンが所定の長さの空間を飛行して、検出器により検出される時間を測定する。試料 に照射されるレーザー光は非常に短いパルス状とされているものの、それにより放出され る多数のイオンの位置及び初速は必ずしも揃っていないため、従来は図1に示すような直 交加速型TOFMSを用いていた。直交加速型TOFMSでは、生成されたイオン14の 飛行方向に対して直交する方向に加速電圧を印加することにより、検出器17に対しては ほぼ定まった位置からイオンの飛行をスタートさせる。なお、図1では反射型(リフレク トロン型)のTOFMSを用いているが、これはもちろん一方向型(リニア型)のもので もよい。

(3)

[0010]

【特許文献1】米国特許第5808300号公報

【特許文献2】特表2003-512702号公報

【非特許文献1】内藤康秀「生体試料を対象にした質量顕微鏡」, J. Mass Spectrom. So c. Jpn., Vol. 53, No. 3, 2005, pp. 125-132.

【非特許文献 2 】豊田岐聡他「マルチターン飛行時間型質量分析計『MULTUM Linear plus 20 』の開発」, J. Mass Spectrom. Soc. Jpn., Vol. 48, No. 5, 2000, pp. 312-317.

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0011]

イメージング質量分析や顕微質量分析では、生体組織や生体細胞内の成分の分析が大き な目的の一つとなっている。特に生体内試料のタンパク質や糖類の分析のニーズが大きい 。このようなタンパク質や糖などの分析を行う際には、イオン化したイオンを衝突誘起型 開裂法(Collision Induced Dissociation = CID)などの方法で開裂させてフラグメン トイオン(子イオン)を生成し、そのフラグメントイオンを分析するMS/MS分析が有 効である。このフラグメントの生成には、イオントラップ装置の利用がきわめて有効であ る。イオントラップを用いれば、単なるMS/MSばかりではなく、更に開裂を繰り返す MSⁿも可能となる。

[0012]

イオントラップはそれ自身が質量分析機能を持つが、それだけでは高い質量分解能を得 ることは難しい。そこで、MS/MS(MSⁿ)解析を行いつつ、分解能の高い質量分析 を行うため、図2に示すように、イオントラップ21の後段にTOFMS22を配置する ことが有効である。図3に示すように、イオントラップ21では、リング電極211に印 加された高周波電圧によりイオンが内部空間に一旦蓄積され、2つのエンドキャップ電極 212、213に印加された直流電圧により一斉に外部に排出される。この排出のタイミ ングを後段のTOFMS22の飛行スタートのタイミングとすることにより、高い分解能 の質量スペクトルを得ることができる。これは、MSⁿ分析ではない通常のMS分析にも 適用できる。

[0013]

このようにイオントラップ21とTOFMS22を組み合わせることにより、効率の良いMS[®]分析を行うことができるとともに、通常のMS分析とMS[®]分析を共に高い分解能 で行うことができる。顕微質量分析装置ではないが、このようなイオントラップとTOF MSを組み合わせた図2に示すようなレーザー質量分析装置は既に実現されている。 【0014】

しかし、従来のこのような装置において、イオントラップ内にイオンを蓄積・排出する 等のイオンの操作は、イオントラップのリング電極に印加する電圧を変化させることによ

10

30

り行われていた。この方式では、大きい質量を持つ(高い質量 / 電荷比を持つ)イオンを トラップするためには、高い電圧を有する高周波電圧をリング電極に印加する必要がある 。しかし、高い高周波電圧を生成するためには大きな電源が必要となり、また、放電の問 題も生ずる。そのため、従来のこのような装置では高い質量数のイオンはトラップするこ とができないという制約があった。

(4)

【0015】

前記の通り、顕微質量分析やイメージング質量分析では生体試料に対する質量分析の要望が高まっているが、生体試料を分析する場合、試料をそのまま試料台に置いて分析する ことになる。この場合、酵素による消化なども行いにくいため、イオントラップにおいて 高い質量数の試料を分析することが強く望まれている。

【0016】

従来の装置ではこのようなイオントラップにおけるトラップ可能質量範囲の問題の他に 、質量分解能の問題も存在する。従来のリニア型TOFMSやリフレクトロン型TOFM Sでは、質量数の分解能は10000程度であるが、タンパク質などでは数万以上の分子 量をもつものも多数存在する。このため、生体組織や生体細胞内の成分を高い精度で質量 分析する場合、従来の装置では十分な分析を行うことができないという問題がある。

【0017】

本発明が解決しようとする課題は、これらの問題を解決した、特に生体試料を分析する に適したレーザー照射質量分析装置を提供することである。

【課題を解決するための手段】

[0018]

上記課題を解決するために成された本発明は、照射位置を制御し<u>ながら</u>試料に<u>繰り返し</u> レーザーを照射し、そこで生成された試料のイオンを質量分析して、試料の位置情報とそ の位置における質量分析情報を得る<u>ことにより、質量分析情報の2次元像を得る</u>レーザー 照射質量分析装置において、

前記レーザーの照射位置を順次移動させるためにステージを移動する及び / 又はレーザ ー光を走査する機構と、

前記機構により、前記レーザーの照射位置を順次移動させるごとに質量分析を行う計測 ・制御部とを備え、

該イオンの質量分析に、周波数駆動型イオントラップと飛行時間型質量分析装置を用い 30 ることを特徴とする。

【0019】

なお、この周波数駆動型イオントラップの駆動方式には、デジタル駆動方式を用いるこ とが望ましい。

[0020]

また、ここで用いる飛行時間型質量分析装置は、マルチターン型飛行時間質量分析装置 とすることが望ましい。

【発明の効果】

[0021]

本発明に係るレーザー照射質量分析装置では周波数駆動型イオントラップを用いること 40 から、高い質量数のイオンをトラップするために高周波電圧の電圧値を上げる必要がなく 、その周波数のみを制御すればよい(具体的には、高い質量数ほど周波数を低くする)。 このため、大きな高周波電源を用意する必要がなく、また放電の心配もないことから、容 易に高分子量試料分析用の質量分析装置を作製することができる。このようなイオントラ ップの周波数制御には、デジタル駆動方式を用いるのが最も適している。

[0022]

また、マルチターン型飛行時間質量分析装置を用いることにより質量分解能を飛躍的に 高めることができ、高分子量の試料を更に、高分解能で分析することができるようになる 。すなわち、タンパク質や糖類などの試料について、高精度で顕微質量分析やイメージ質 量分析を行うことが可能となる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0023]

本発明の一実施例である顕微質量分析装置を図4に示す。この顕微質量分析装置は、イ オントラップにデジタル回路による周波数駆動方式のものを用い、飛行時間型質量分析装 置としてリフレクトロン型のものを用いたものである。試料の観察、レーザー照射及び移 動(走査)の部分は図1、図2に示した従来の装置と同様であるため説明を省略し、ここ ではレーザー照射で生成されたイオンの動きについて説明する。

(5)

[0024]

照射箇所で発生した試料のイオンは、試料室と質量分析室の圧力差やイオンガイドの電 界により質量分析室のイオントラップに導入される。このとき、イオントラップにおいて も、イオンを導入し、内部空間に保持(トラップ)するための電圧が各電極に印加されて いる。前記の通り、本実施例ではこのイオントラップには周波数駆動型のものを使用し、 図 5 (b) 又は(c) に示すようなデジタル駆動回路を用いて生成した図 5 (a) に示すような波 形を有する高周波電圧をリング電極に印加する。このデジタル駆動回路では、リング電極 に印加する電圧の大きさは、2つのDC電源(DC P/S)の電圧V1、V2の大きさにより定めら れているが、その周波数は、各電圧の印加時間W1、W2を任意に設定することにより、自由 に設定することができる。従って、図8に示すイオンの安定領域S条件をイオントラップ 内で実現するために、従来のように高周波電圧の大きさで制御するのではなく、周波数を 制御することにより行うことができる。

[0025]

具体的には、従来の電圧制御方式では、高い質量数のイオンをトラップするためには高 い電圧(高周波電圧)が必要であったが、周波数駆動方式のイオントラップでは、周波数 を低くするほど高い質量数のイオンをトラップすることができる。高電圧の生成には前述 のような問題があったが、周波数制御は図5(b)(c)等のような小型且つ安価なデジタル駆 動回路により容易に行うことができるため、高質量数のイオンをトラップすることが可能 となる。従って、試料として生体試料をそのまま用いた場合にも、タンパク質や糖類等の 大きな分子量のイオンをそのままトラップすることができ、生体試料に関する豊富な情報 を得ることができるようになる。

[0026]

イオントラップにトラップされたイオンは、場合によってはCIDによりフラグメント 化が行われる。

[0027]

イオントラップにトラップされているイオンは、2つのエンドキャップ電極の間に直流 の高電圧を印加することにより一斉に引き出され、後段の飛行時間型質量分析装置に導入 される。導入されたイオンは長い無電界飛行空間を自由飛行し、他端に設けられた反射器 (リフレクトロン)により反射されて再び飛行空間を飛行して検出器に入る。イオントラ ップから放出された時刻と検出器により検出される時刻の間の飛行時間が各イオンの質量 数に依存することから、検出器による検出時刻から検出されたイオンの質量数が求められ る。

[0028]

ここで、イオントラップの引き出し口(出口)から遠い位置にあるイオンはそこに到達 するまでのより長い時間加速され、出口に近い位置にあるイオンは加速時間が短いため、 イオントラップから引き出されたイオンは空間的・時間的なフォーカシングが行われる。 このフォーカス点を後段のリフレクトロン型飛行時間質量分析装置の入口側のフォーカス 点に一致させておくことにより、リフレクトロン型飛行時間質量分析装置の検出器におい ても時間フォーカスができるため、高い質量分解能を実現することができる。

[0029]

本発明の別の実施例である顕微質量分析装置を図6に示す。この顕微質量分析装置は、 イオントラップの駆動回路に前記実施例と同様、デジタル周波数駆動方式のものを用い、 飛行時間型質量分析装置にはリフレクトロン型ではなくてマルチターン型のものを用いた 10

20

30

ものである(マルチターン型飛行時間質量分析装置については、非特許文献2参照)。図 6の例では、マルチターン型飛行時間質量分析装置のイオン周回路は「8」字形となって いるが、これは図7に示すような単純周回型でももちろん構わない。

(6)

【 0 0 3 0 】

前記実施例と同様の方法でイオントラップにトラップされ、引き出されたイオンは、マ ルチターン型飛行時間質量分析装置41、51に入り、そこに設けられたイオン周回路を 所定回数周回する。この周回回数を多くすることにより、イオンの飛行距離はリニア型や リフレクトロン型よりもはるかに大きくなり、100000以上の高い質量分解能も十分 実現可能となる。

【0031】

10

20

マルチターン型飛行時間質量分析装置では、同じ質量数でもエネルギーの高いイオンは 周回路の各コーナーに置かれた転向電極42、52の中心軌道よりも外側を通るため、飛 行距離が長い。逆に、エネルギーの低いイオンは内側の軌道を通るため、飛行距離は短い 。そこで、各転向電極42、52に印加する電圧を適切に制御することにより、或る1点 から出た同一質量数の複数のイオンは、それらのエネルギーの異なっていても周回路を1 周した後にその点に同一時間に戻ってくるようにすることができる(時間的・空間的フォ ーカシング)。このフォーカス点を上記イオントラップ31のフォーカス点に一致させる ことにより、イオントラップ31からエネルギー分布をもって出射した多数のイオンも周 回毎にフォーカスされ、高分解能の質量分析を行うことができるようになる。なお、イオ ンを検出器43、53へ送るためのガイド電極44、54もこのフォーカス点に一致させ るようにする。

【図面の簡単な説明】

[0032]

【図1】従来の顕微質量分析装置の概略構成図。

【図2】従来のイオントラップを用いた顕微質量分析装置の主要部の概略構成図。

【図3】イオントラップの概略構成図(a)と、各電極に印加される電圧のイオン引き出し 時点前後の変化の様子を示すグラフ(b)。

【図4】本発明の一実施例であるリフレクトロン型飛行時間質量分析装置を用いた顕微質 量分析装置の主要部の概略構成図。

【図 5】実施例の顕微質量分析装置のイオントラップのリング電極に印加される高周波電 30 圧の波形図(a)、およびその高周波電圧を生成するためのデジタル駆動回路の構成例(b)、 (c)。

【図6】本発明の別の実施例であるマルチターン型飛行時間質量分析装置を用いた顕微質 量分析装置の主要部の概略構成図。

【図7】マルチターン型飛行時間質量分析装置の別のイオン周回路の例の概略構成図。 【図8】イオントラップ内におけるイオンの安定化領域を示す a - q パラメータ図。

【符号の説明】

- [0033]
- 1 1 ... C C D
- 1 2 ... 試料

13…レーザー光源

14…イオン

15...イオンガイド

1 6 ... 質量分析部

17...検出器

21...イオントラップ

211...リング電極

212、213…エンドキャップ電極

22…リフレクトロン型飛行時間質量分析装置

31…周波数駆動型イオントラップ





















【図6】







フロントページの続き

- (72)発明者 吉田 佳一 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所内
- (72)発明者 島津 光三
 京都市中京区西ノ京桑原町1番地 株式会社島津製作所内
 (72)発明者 瀬藤 光利
 田畑県四岐古明古吉町宣市山に 1 古営井同利田郡間はし白ば利営町容郡構 岡崎松

愛知県岡崎市明大寺町字東山5-1 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 岡崎統合バイオサ イエンスセンター内

- (72)発明者 新間 秀一 愛知県岡崎市明大寺町字東山5-1 大学共同利用機関法人自然科学研究機構 岡崎統合バイオサ イエンスセンター内
- (72)発明者 豊田 岐聡 大阪府吹田市山田丘1番1号 国立大学法人大阪大学内

審査官 遠藤 直恵

- (56)参考文献 特開2004-303719(JP,A) 特表2003-512702(JP,A) 特開平08-189917(JP,A) 米国特許第05808300(US,A) 特開2005-116246(JP,A)
- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名) H01J 49/00-49/48 G01N 27/60-27/70,27/92